

# Minőségbiztosítás a mikroelektronikában

## II. Zárthelyi dolgozat

2015. május 5.

1. Félvezetők fajlagos ellenállása illetve lemezszerű rétegek négyzetes ellenállása homogén ill. inhomogén adalékolás esetén, Gummel szám
2. Mi a tesztábrák definíciója? Milyen tesztábrák szükségesek a fotoreziszt és marási technológia felbontásának meghatározásához?
3. Mért C-V görbék kiértékeléséből meghatározható paraméterek, a számítások alapelvei (nem a képlet a lényeg, hanem a fizikai háttér ismertetés)
4. Elektronsugaras technikák félvezetők vizsgálatára